

# FIB-SEMセミナー

名古屋大学未来材料システム研究所超高压電子顕微鏡施設では文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業の一環として、生物試料を主体とした集束イオン/電子ビーム加工観察装置(FIB-SEM)のセミナーを開催致します。ご興味のある方はご参加下さるようご案内申し上げます。

2016年 11月 7日 月

定員  
10名

参加費  
無料

会場：名古屋大学未来材料システム研究所  
超高压電子顕微鏡施設

## プログラム

1. 10:00～10:45 名古屋大学 荒井重勇  
「ナノテクノロジープラットフォーム事業の紹介とその利用例」
2. 10:45～11:30 日立ハイテクノロジーズ 許斐麻美  
「生物試料の作製法」
3. 13:00～13:45 藤田保健衛生大学 森山陽介  
「生物試料の観察例」
4. 13:45～14:30 日立ハイテクサイエンス 中谷郁子  
「FIB-SEM MI-4000Lの装置概要・取扱説明」
5. 15:00～17:00 名古屋大学 中尾知代、榎本早希子、中野美恵子  
「施設見学とMI-4000Lの実演」

連絡先：名古屋大学未来材料システム研究所超高压電子顕微鏡施設

TEL : 052-789-3632 FAX : 052-789-3174

E-mail : [nanoplat@nagoya-microscopy.jp](mailto:nanoplat@nagoya-microscopy.jp)